

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

11040999

PUBLICATION DATE

12-02-99

APPLICATION DATE

18-07-97

APPLICATION NUMBER

09193460

APPLICANT: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD;

INVENTOR: IMAFUKU SHIGEKI;

INT.CL.

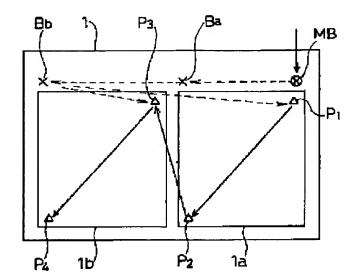
: H05K 13/04 H05K 13/00

TITLE

: ELECTRONIC COMPONENT

MOUNTING METHOD ON MULTIPLY

FORMED BOARDS



ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electronic component mounting method by which a defective circuit pattern is identified, when plural circuit patterns formed on multiply formed boards have a defect, so as to avoid mounting component onto the defective circuit pattern.

SOLUTION: In the check process before a multiply formed pattern 1 is supplied to an electronic component mounting device, when any defect is found out in the circuit patterns, a bad mark Ba or Bb is marked on a board, and a master bad mark MB denoting the presence of the defective circuit pattern is marked on the board. The electronic component mounting device, receiving the multiply formed board 1 mounts component on the entire circuit pattern when no master bad mark MB, is marked and identifies a defective circuit pattern based on the detection of the bad mark Ba or Bb, when the master bad mark MB is in existence for mounting component on the circuit patterns, except the defective circuit pattern.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

This Page Blank (uspto)

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-40999

(43)公開日 平成11年(1999)2月12日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

H05K 13/04

H05K 13/04

Z

13/00

13/00

В

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平9-193460

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(22)出願日 平成9年(1997)7月18日

(72)発明者 山本 裕樹

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 今福 茂樹

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

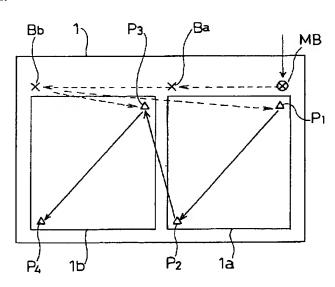
(74)代理人 弁理士 石原 勝

(54) 【発明の名称】 多面取り基板に対する電子部品実装方法

(57)【要約】

【課題】 多面取り基板上に形成された複数の回路パタ ーンに不良があるとき、不良回路パターンを識別して、 その不良回路パターンへの部品実装を実行しないように する電子部品実装方法を提供する。

【解決手段】 電子部品実装機に搬入する以前の検査工 程において回路パターンに不良が検出されたときバッド マークB。またはB。をマーキングすると共に、不良回 路パターンが存在することを示すマスターバッドマーク MBをマーキングする。この多面取り基板1が搬入され た電子部品実装機はマスターバッドマークMBがないと きは全回路パターンに部品実装を実行し、マスターバッ ドマークMBがあるときはバッドマークB。、B。の検 出から不良回路パターンを識別して、不良回路パターン を除く回路パターンに部品実装を実行する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 電子部品実装機により部品実装を行う回路基板が、1枚の基板上にそれぞれ独立した複数の回路パターンを形成した多面取り基板であって、これを前記電子部品実装機に搬入する以前の回路パターン検査工程において、不良の回路パターンが検出されたときには不良を示すバッドマークをマーキングし、この多面取り基板が搬入された電子部品実装機において、前記バッドマークを検出するバッドマーク検出動作を実行し、バッドマークのある回路パターンへの部品実装動作を実行しないように制御する多面取り基板に対する電子部品実装方法において、

前記回路パターン検査工程において、不良検出された回 ,路パターンがあったとき、その回路パターン近傍の所定 位置に不良回路パターンであることを示すバッドマーク ,をマーキングすると共に、多面取り基板の所定位置に複 数の回路パターンの中に不良回路パターンが存在することを示すマスターバッドマークをマーキングし、

前記電子部品実装機において、前記マスターバッドマークの検出動作を実行してマスターバッドマークが検出されたときには、前記バッドマーク検出動作を実行してバッドマークが検出された回路パターンを除く他の回路パターンへの部品実装動作を実行し、マスターバッドマークが検出されなかったときにはバッドマーク検出動作を中止して各回路パターンへの部品実装動作を実行することを特徴とする多面取り基板に対する電子部品実装方法。

【請求項2】 電子部品実装機により部品実装を行う回路基板が、1枚の基板上にそれぞれ独立した複数の回路パターンを形成した多面取り基板であって、これを前記電子部品実装機に搬入する以前の回路パターン検査工程において、不良の回路パターンが検出されたときには不良を示すバッドマークをマーキングし、この多面取り基板が搬入された電子部品実装機において、前記バッドマークを検出するバッドマーク検出動作を実行し、バッドマークのある回路パターンへの部品実装動作を実行しないように制御する多面取り基板に対する電子部品実装方法において、

前記回路パターン検査工程において、不良検出された回路パターンがあったとき、多面取り基板の所定位置に不良検出された回路パターンを識別でるような不良回路パターン識別バッドマークを各回路パターン毎に隣り合うようにマーキングし、

前記電子部品実装機において、前記不良回路パターン識別バッドマーク検出動作を実行して不良回路パターン識別バッドマークが検出されたとき、不良回路パターン識別バッドマークから識別された回路パターンを除く他の回路パターンへの部品実装動作を実行し、不良回路パターン識別バッドマークが検出されなかったときには各回路パターンへの部品実装動作を実行することを特徴とす

る多面取り基板に対する電子部品実装方法。

【請求項3】 電子部品実装機により部品実装を行う回路基板が、1枚の基板上にそれぞれ独立した複数の回路パターンを形成した多面取り基板であって、これを前記電子部品実装機に搬入する以前の回路パターン検査工程において、不良の回路パターンが検出されたときには不良を示すバッドマークをマーキングし、この多面取り基板が搬入された電子部品実装機において、前記バッドマークを検出するバッドマーク検出動作を実行し、バッドマークのある回路パターンへの部品実装動作を実行しないように制御する多面取り基板に対する電子部品実装方法において、

前記回路パターン検査工程において、不良検出された回路パターンがあったとき、多面取り基板の所定位置に不良判定された回路パターンを識別できるような不良回路パターン識別バッドマークを回路パターン毎に隣り合う位置にマーキングすると共に、この不良回路パターン識別バッドマークに隣り合う位置に複数の回路パターンの中に不良回路パターンが存在することを示すマスターバッドマークをマーキングし、

前記電子部品実装機において、前記マスターバッドマークの検出動作を実行してマスターバッドマークが検出されたときには、前記不良回路パターン識別バッドマークの検出動作を実行して不良回路パターン識別バッドマークから識別された回路パターンを除く他の回路パターンへの部品実装動作を実行し、マスターバッドマークが検出されなかったときには、不良回路パターン識別バッドマークの検出動作を中止して部品実装動作を実行することを特徴とする多面取り基板に対する電子部品実装方法

【請求項4】 不良回路パターン識別バッドマークが、各回路パターン個別の識別マークである請求項2または3記載の多面取り基板に対する電子部品実装方法。

【請求項5】 不良回路パターン識別バッドマークが、不良回路パターン識別バッドマーク検出動作の動作経路上に隣り合って設定された各回路パターン別のマーキング位置にマーキングされるバッドマークである請求項2または3記載の多面取り基板に対する電子部品実装方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子部品実装機により電子部品を回路基板に装着する電子部品実装方法に係り、特に1基板上に複数の回路パターンを形成した多面取り基板に対する電子部品実装方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】個々に回路基板として完成される回路パターンを1枚の基板上に複数に展開した多面取り基板を電子部品実装機に搬入して、複数の回路パターンに対し

て一括して部品実装を実行することにより効率的な回路 基板生産を行うことができる。

【0003】前記多面取り基板は、電子部品実装機に搬入する以前の工程において個々の回路パターンについて検査が実施され、不良が検出された回路パターンに対しては所定位置にバッドマークがマーキングされる。この多面取り基板が搬入された電子部品実装機は、部品実装の動作を開始する前に前記バッドマークの検出動作を行って、バッドマークを検出すると、バッドマークのある回路パターンに対しての部品実装を実行しないように制御される。

【0004】図5は、電子部品実装機の要部構成を示すもので、X軸駆動部11とY軸駆動部12とによりX-Y平面上を自在移動するXYテーブル13上の所定位置に基板4が保持され、前記XYテーブル13の上方に配置された装着ヘッド14が装備する複数の吸着ノズル15から電子部品が基板4の所定位置に装着できるように構成されている。また、XYテーブル13の上方に配置されたカメラ16は、電子部品装着位置補正のために基板4上に記されたパターンマークを認識すると共に、前記バッドマークの検出を行って、コントローラ17に入力する。コントローラ17はメモリ18に記憶された実装対象基板の部品実装データに基づき電子部品実装機の動作を制御する。

【0005】前記基板4は、多面取り基板として構成さ れており、図6に多面取り基板の構成例を示すように、 基板4上に第1回路パターン4a及び第2回路パターン 4bの2面の回路パターンが形成されている。第1、第 2の各回路パターン4a、4bそれぞれの所定位置には 部品実装の位置決め基準となるパターンマークP₁~P 4 が記されており、また、第1、第2の各回路パターン 4a、4bそれぞれの所定位置にバッドマーク B_1 、B2 のマーキング位置が設定されており、電子部品実装機 に搬入される以前の回路パターンの検査工程において不 良が検出されたときには、このマーキング位置にバッド マークB₁、B₂が図示するようにマーキングされる。 【0006】上記のように構成された基板4が電子部品 実装機に搬入され、XYテーブル13上に搬入される と、メモリ18に設定された動作手順に従って動作が開 始され、X軸駆動部11及びY軸駆動部12によりXY テーブル13を移動させて、基板4の第1回路パターン 4 aのバッドマークB₁ のマーキング位置をカメラ16 の直下に移動させる。カメラ16の直下に基板4の各マ ーク位置を移動させる手順は、図6に示す矢印の順で、 図6の場合は、各バッドマークB、、B。のマーキング 位置に $バッドマークB_1 、 B_2$ がない状態の場合で、い ずれかのマーキング位置にバッドマークB₁ またはB₂ が検出された場合には、その検出結果はメモリ18に記 憶されると共に、バッドマークB, またはB。が検出さ れた第1回路パターン4aまたは第2回路パターン4b に対するパターンマークP1、P2またはP3、P4の 検出動作は行わず、部品実装の動作も実行されない。 【0007】

【発明が解決しようとする課題】上記バッドマークの検出動作において、バッドマークの検出のために基板を各回路パターンのマーキング位置に移動させる動作が必要となるため移動距離が大きく、その必要時間の累積は電子部品実装の生産性を低下させている問題点があった。【0008】本発明の目的とするところは、バッドマーク検出を効率的に行う多面取り基板に対する部品実装方法を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため の本願の第1発明は、電子部品実装機により部品実装を 行う回路基板が、1枚の基板上にそれぞれ独立した複数 の回路パターンを形成した多面取り基板であって、これ を前記電子部品実装機に搬入する以前の回路パターン検 査工程において、不良の回路パターンが検出されたとき には不良を示すバッドマークをマーキングし、この多面 取り基板が搬入された電子部品実装機において、前記バ ッドマークを検出するバッドマーク検出動作を実行し、 バッドマークのある回路パターンへの部品実装動作を実 行しないように制御する多面取り基板に対する電子部品 実装方法において、前記回路パターン検査工程におい て、不良検出された回路パターンがあったとき、その回 路パターン近傍の所定位置に不良回路パターンであるこ とを示すバッドマークをマーキングすると共に、多面取 り基板の所定位置に複数の回路パターンの中に不良回路 パターンが存在することを示すマスターバッドマークを マーキングし、前記電子部品実装機において、前記マス ターバッドマークの検出動作を実行してマスターバッド マークが検出されたときには、前記バッドマーク検出動 作を実行してバッドマークが検出された回路パターンを 除く他の回路パターンへの部品実装動作を実行し、マス ターバッドマークが検出されなかったときにはバッドマ ーク検出動作を中止して各回路パターンへの部品実装動 作を実行することを特徴とする。

【0010】上記第1発明に係る電子部品実装方法によれば、回路パターン検査工程において不良が検出されたときには、バッドマークと共にマスターバッドマークが所定位置にマーキングされるので、電子部品実装機では、前記マスターバッドマークを検出したときにのみバッドマークの検出動作を実行すればよく、マスターバッドマークが検出されなかったときにはバッドマークの検出動作は省略できる。従って、1基板毎にバッドマークを検出するために要する無駄時間は削減され、部品実装の生産性を向上させることができる。

【0011】また、本願の第2発明は、電子部品実装機により部品実装を行う回路基板が、1枚の基板上にそれぞれ独立した複数の回路パターンを形成した多面取り基

板であって、これを前記電子部品実装機に搬入する以前 の回路パターン検査工程において、不良の回路パターン が検出されたときには不良を示すバッドマークをマーキ ングし、この多面取り基板が搬入された電子部品実装機 において、前記バッドマークを検出するバッドマーク検 出動作を実行し、バッドマークのある回路パターンへの 部品実装動作を実行しないように制御する多面取り基板 に対する電子部品実装方法において、前記回路パターン 検査工程において、不良検出された回路パターンがあっ たとき、多面取り基板の所定位置に不良検出された回路 パターンを識別でるような不良回路パターン識別バッド マークを各回路パターン毎に隣り合うようにマーキング し、前記電子部品実装機において、前記不良回路パター , ン識別バッドマーク検出動作を実行して不良回路パター ン識別バッドマークが検出されたとき、不良回路パター い識別バッドマークから識別された回路パターンを除く 他の回路パターンへの部品実装動作を実行し、不良回路 パターン識別バッドマークが検出されなかったときには 各回路パターンへの部品実装動作を実行することを特徴 とする。

【0012】上記第2発明に係る電子部品実装方法によ れば、回路パターン検査工程において不良が検出された ときには、多面取り基板の所定位置に不良判定された回 路パターンを識別できるような不良回路パターン識別バ ッドマークがマーキングされるので、電子部品実装機で は不良回路パターン識別バッドマークが検出されたと き、この不良回路パターン識別バッドマークから識別で きる回路パターンを除く他の回路パターンに対して部品 実装の動作を実行すればよく、不良回路パターン識別バ ッドマークが検出されなかったときには全回路パターン に対して部品実装を実行する。また、各回路パターン毎 の不良回路パターン識別バッドマークは、隣り合う位置 にマーキングされるので、これを検出するための移動距 離は小さくなる。従って、1基板毎にバッドマークを認 識するために要する無駄時間は削減され部品実装の生産 性を向上させることができる。

【0013】更に、本願の第3発明は、電子部品実装機により部品実装を行う回路基板が、1枚の基板上にそれぞれ独立した複数の回路パターンを形成した多面取り基板であって、これを前記電子部品実装機に搬入する以前の回路パターン検査工程において、不良の回路パターンが検出されたときには不良を示すバッドマークをマーキングし、この多面取り基板が搬入された電子部品実装機において、前記バッドマークを検出するバッドマーク検出動作を実行し、バッドマークのある回路パターンへの部品実装動作を実行しないように制御する多面取り基板に対する電子部品実装方法において、前記回路パターン検査工程において、不良検出された回路パターンがあったとき、多面取り基板の所定位置に不良判定された回路パターンを識別でるような不良回路パターン識別バッド

マークを回路パターン毎に隣り合う位置にマーキングすると共に、この不良回路パターン識別バッドマークに隣り合う位置に複数の回路パターンの中に不良回路パターンが存在することを示すマスターバッドマークをマーキングし、前記電子部品実装機において、前記マスターバッドマークの検出動作を実行してマスターバッドマークが検出されたときには、前記不良回路パターン識別バッドマークの検出動作を実行して不良回路パターン識別バッドマークから識別された回路パターンを除く他の回路パターンへの部品実装動作を実行し、マスターバッドマークが検出されなかったときには、不良回路パターン識別バッドマークの検出動作を中止して部品実装動作を実行することを特徴とする。

【0014】上記第3発明に係る電子部品実装方法によ れば、回路パターン検査工程において不良が検出された ときには、マスターバッドマークがマーキングされると 共に、不良回路パターン識別バッドマークがマーキング されるので、電子部品実装機では、前記マスターバッド マークが検出されたときに不良回路パターン識別バッド マークの検出動作を行って、この不良回路パターン識別 バッドマークから識別できる回路パターンを除く他の回 路パターンに対して部品実装の動作を実行すればよく、 マスターバッドマークが検出されなかったときには不良 回路パターン識別バッドマークの検出動作は省略でき る。また、マスターバッドマーク及び各不良回路パター ン識別バッドマークは互いに隣り合う位置にマーキング されるので、これらを検出するための移動距離は小さく なる。従って、1基板毎にバッドマークを認識するため に要する無駄時間は大幅に削減され部品実装の生産性を 向上させることができる。

【0015】上記第2及び第3発明に係る電子部品実装方法において、不良回路パターン識別バッドマークは、各回路パターン個別の識別マークとしてマーキングすることにより、前記識別マークから不良の回路パターンが識別でき、部品実装を実行しない回路パターンの判断を迅速に行うことができる。

【0016】また、不良回路パターン識別バッドマークは、不良回路パターン識別バッドマーク検出動作の移動経路上に隣り合って設定された各回路パターン別のマーキング位置にマーキングされるバッドマークとすることにより、バッドマークがマーキングされた位置から不良の回路パターンが識別でき、更に、これらのバッドマークのマーキング位置を隣り合うように設定しておくことによってバッドマークを検出するための移動動作が少なくなり、部品実装を実行しない回路パターンの判断を迅速に行うことができる。

[0017]

【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照して本発明 の一実施形態について説明し、本発明の理解に供する。 尚、従来構成と共通する要素には同一の符号を付し、そ の説明は省略する。

【0018】図1は、本発明の第1の実施形態に係る多面取り基板1の各マーク配置とマーク検出手順とを示すもので、多面取り基板1上に形成された第1、第2の各回路パターン1a、1bそれぞれの所定位置には、部品実装の位置決め基準とするパターンマークが、第1の回路パターン1aにはパターンマークP₁、P₂、第2の回路パターン1bにはパターンマークP₃、P₄として設けられている。また、電子部品実装機に搬入される以前の回路パターン検査工程において不良が検出されたときには、不良検出された第1の回路パターン1aまたは第2の回路パターン1bの所定のマーキング位置にバッ・ドマークB_aまたはB_bがマーキングされる。更に、マーキング位置にバッドマークB_aまたはB_bがマーキングされたときには、多面取り基板1の所定位置にマスターバッドマークMBがマーキングされる。

【0019】上記構成になる多面取り基板1に対して、 先に図5に示した電子部品実装機が行う部品実装の動作 手順について、図2のフローチャートを参照して説明す る。

【0020】尚、同図に示すS1、S2…は、動作手順を示すステップ番号であって、本文に添記する番号と一致する。

【0021】電子部品実装機のXYテーブル13上に多 面取り基板1が搬入されると、X軸駆動部11及びY軸 駆動部12を駆動して、XYテーブル13上に保持され た多面取り基板1のマスターバッドマークMBのマーキ ング位置がカメラ16の直下に位置するようにXYテー ブル13を移動させるマスターバッドマーク検出動作が 実行される(S1)。カメラ16によるマスターバッド マークMBの検出動作により(S2)、マスターバッド マークMBが検出されたときには、コントローラ17は XYテーブル13の移動により、図1に破線で示すよう に、第1の回路パターン1aのバッドマークB。のマー キング位置をカメラ16の直下に移動させ、カメラ16 によるバッドマークB。の検出動作の結果をメモリ18 に記憶させる(S3)。続いて、第2の回路パターン1 bのバッドマークB。のマーキング位置をカメラ16の 直下に移動させ、カメラ16によるバッドマークB。の 検出動作の結果をメモリ18に記憶させる(S4)。

【0022】前記ステップS2の検出動作においてマスターバッドマークMBが検出されなかったときには、コントローラ17はメモリ18に第1、第2の各回路パターン1a、1bにバッドマークBa、Bb無しと記憶させ(S5)、上記バッドマーク検出の動作は省略する。従って、各バッドマークBa、Bbを検出するためのXYテーブル13の移動動作、カメラ16及びコントローラ17によるバッドマーク検出処理動作は、マスターバッドマークMBが検出されたときにのみ実行すればよく、部品実装を開始するまでの無駄時間が削減される。

【0023】以下、ステップS6~ステップS13の部品装着動作は、上記マスターバッドマークMBまたはバッドマーク B_a 、 B_b の検出動作の結果を記憶したメモリ18の記憶データに基づくコントローラ17の制御により実行される。

【0024】まず、第1の回路パターン1aにバッドマーク B_a がないときは(S6)、図1に実線で示すように、XYテーブル13を移動させて第1の回路パターン1aのパターンマーク P_1 、 P_2 の位置をカメラ16の 直下に順次移動させ、カメラ16のパターンマーク P_1 、 P_2 位置の認識から第1の回路パターン1aの部品装着位置を補正する(S7)。

【0026】第1の回路パターン1 aにバッドマー0 B a がないときは(S10)、前記パターンマー0 P_1 、 P_2 位置の認識からの部品装着位置の補正データに基づいて第1の回路パターン1 aに対する部品実装が実行される(S11)。同様に、第1の回路パターン1 aにバッドマー0 P_3 がないときは(S12)、パターンマー0 P_3 、 P_4 位置の認識からの部品装着位置を補正データに基づいて第2の回路パターン1 bに対する部品実装が実行される(S13)。第2 回路パターン1 bにバッドマー0 P_3 があるときは、第2 回路パターン1 bにがする部品実装が中土される。

【0027】以上の動作手順により、電子部品実装機による1枚の多面取り基板1に対する電子部品実装が終了するので、XYテーブル13上から多面取り基板1を搬出し、次の多面取り基板1の搬入を受入れ、同様の動作手順を繰り返す。上記動作手順では、マスターバッドマークMBが検出されなかったときにはバッドマーク検出動作を省略できるので、1枚の多面取り基板1に対する処理動作時間が短縮され、生産性を向上させることができる。

【0028】次に、本発明の第2の実施形態について説明する。図3は、第2の実施形態に係る多面取り基板2の各マーク配置とマーク検出手順とを示すものである。尚、先の実施形態の構成と共通する要素には同一の符号を付し、その説明は省略する。

【0029】図3において、多面取り基板2上に形成された第1、第2の各回路パターン2a、2bそれぞれの

所定位置には、部品実装の位置決め基準とするパターンマークが、第1の回路パターン2aにはパターンマーク P_1 、 P_2 、第2の回路パターン2bにはパターンマーク P_3 、 P_4 として設けられている。また、電子部品実装機に搬入される以前の回路パターン検査工程において不良が検出されたときには、図示するように不良検出された第1の回路パターン2bそれぞれが隣り合って設定された所定のマーキング位置にバッドマーク(不良回路パターン識別バッドマーク) B_a または B_b がマーキングされる。

【0030】上記構成になる多面取り基板2に対応する電子部品実装機の動作について以下に説明する。

【0031】電子部品実装機のXYテーブル13上に多面取り基板2が搬入されると、X軸駆動部11及びY軸駆動部12を駆動して、まず、XYテーブル13上に保持された多面取り基板1の第1の回路パターン2aに該当するバッドマークB。のマーキング位置がカメラ16の直下に位置するようにXYテーブル13を移動させ、カメラ16によるバッドマーク検出動作を実行する。次に、第2の回路パターン2bに該当するバッドマークB。のマーキング位置をカメラ16の直下に移動させ、同様にバッドマーク検出動作を実行する。

【0032】このバッドマーク検出動作により、バッドマーク B_a 、 B_b のマーキング位置にバッドマーク B_a または B_b がマーキングされていることをカメラ16が認識したときには、コントローラ17は第1の回路パターン2 aまたは第2の回路パターン2 bは不良であることをメモリ18に記憶させる。バッドマー2 B_b のマーキング位置にバッドマー2 B_a または B_b がマーキングされていなかったときには、図3に実線で示すように、第1の回路パターン2 aのパターンマー2 P_1 、 P_2 、第2の回路パターン2 bのパターンマー2 P_3 、 P_4 の認識動作を実行して、第1、第2の各回路パターン2 a、2 bの部品実装位置の補正を行い、部品実装の動作を実行する。

【0033】バッドマー0B_a、Bbのマーキング位置にバッドマー0B_aまたはBbがマーキングされていたときには、コントローラ17はメモリ18の記憶データに基づきバッドマー0B_aまたは0B_bが検出された側の回路パターンへの部品実装を実行しないように制御する。図3に破線で示す例は、第1の回路パターン02 aが不良である場合の動作経路で、第01 の回路パターン02 aに対するパターンマー02 の認識動作は中止して、第02 の認識動作を実行している。

【0034】上記構成では、バッドマーク B_a 、 B_b は多面取り基板2の所定位置に隣り合ってマーキングされているので、バッドマーク検出動作のためにXYテーブル13を移動させる距離は短く、バッドマーク検出動作のための動作時間は短縮される。

【0035】また、バッドマークBa、B。は、それぞれマーキング位置による第1、第2の各回路パターン2a、2bの識別でなく、マークの形状等の変化により第1、第2の各回路パターン2a、2bを識別できるようにすることもできる。

【0036】次いで、本発明の第3の実施形態について 説明する。図4は第3の実施形態に係る多面取り基板3 の各マーク配置とマーク検出手順とを示すものである。 尚、先の実施形態の構成と共通する要素には同一の符号 を付し、その説明は省略する。

【0037】図4において、多面取り基板3上に形成さ れた第1、第2の各回路パターン3a、3bそれぞれの 所定位置には、部品実装の位置決め基準とするパターン マークが、第1の回路パターン3 aにはパターンマーク P_1 、 P_2 、第2の回路パターン3bにはパターンマー クP₃、P₄として設けられている。また、電子部品実 装機に搬入される以前の回路パターン検査工程において 不良が検出されたときには、図示するように不良検出さ れた第1の回路パターン2aまたは第2の回路パターン 2 b それぞれに隣り合って設定された所定のマーキング 位置にバッドマーク(不良回路パターン識別バッドマー ク) B_a または B_b がマーキングされる。更に、バッド マークB。またはB。がマーキングされたときには、バ ッドマークBa、B。のマーキング位置と隣り合う所定 位置にマスターバッドマークMBがマーキングされる。 【0038】上記構成になる多面取り基板3に対応する 電子部品実装機の動作について以下に説明する。

【0039】電子部品実装機のXYテーブル13上に多面取り基板3が搬入されると、X軸駆動部11及びY軸駆動部12を駆動して、まず、XYテーブル13上に保持された多面取り基板3のマスターバッドマークMBのマーキング位置がカメラ16の直下に位置するようにXYテーブル13を移動させ、カメラ16によるマスターバッドマーク検出動作を実行する。

【0040】このマスターバッドマーク検出動作により マスターバッドマークMBが検出されなかったときに は、第1、第2の各回路パターン3a、3bに不良はな いので、パターンマーク認識動作に移行し、パターンマ ーク認識による部品実装位置の補正を行って部品実装の 動作を実行する。一方、マスターバッドマークMBが検 出されたときには、第1の回路パターン3aまたは第2 の回路パターン3 bに不良があるので、不良の回路パタ ーンを識別するためにバッドマーク検出動作を実行す る。即ち、マスターバッドマークMB位置から第1の回 路パターン3aに該当するバッドマークB。のマーキン グ位置がカメラ16の直下に位置するようにXYテーブ ル13を移動させ、カメラ16によるバッドマーク検出 動作を実行する。次に、第2の回路パターン3bに該当 するバッドマークB。のマーキング位置をカメラ16の 直下に移動させ、同様にバッドマーク検出動作を実行す

る。

【0041】このバッドマーク検出動作により、バッドマークBa、Bbのマーキング位置にバッドマークBaまたはBbがマーキングされていることをカメラ16が認識したときには、コントローラ17は第1の回路パターン3aまたは第2の回路パターン3bは不良であることをメモリ18に記憶させる。コントローラ17はメモリ18の記憶データに基づきバッドマークBaまたはBbが検出された側の回路パターンへの部品実装を実行しないように制御する。

【0042】上記構成では、マスターバッドマークMB及びバッドマークBa、Bbは多面取り基板2の所定位置に隣り合ってマーキングされているので、マスターバッドマーク検出動作及びバッドマーク検出動作のためにXYテーブル13を移動させる距離は短く、バッドマーク検出動作のための動作時間は短縮される。また、マスターバッドマーク MBが検出されなかったときには、バッドマークBa、Bbの検出動作は省略できるので、各マークのマーキング位置を隣り合う位置に設定したことと相まって部品実装を開始するまでの無駄時間が大幅に短縮される。

【0043】また、バッドマーク B_a 、 B_b は、それぞれマーキング位置による第1、第2の各回路パターン2a、2bの識別でなく、マークの形状等の変化により第1、第2の各回路パターン2a、2bを識別できるようにすることもできる。

【0044】以上説明した第1~第3の実施形態に係る電子部品実装機においては、XYテーブル13の移動により多面取り基板1~3の所定位置をカメラ16の直下に移動させ、部品実装においても装着ヘッド14の吸着ノズル15の直下に部品装着位置を移動させるように構成されているが、多面取り基板1~3を所定位置に位置決め固定して、カメラまたは装着ヘッドの側を移動させるように構成された電子部品実装機においても同様に実施することができる。

[0045]

【発明の効果】以上の説明の通り本願の第1発明によれば、多面取り基板上に形成された複数の回路パターンに不良の回路パターンがあるときには、バッドマークがマーキングされると共に、所定位置に不良回路パターンの存在を示すマスターバッドマークがマーキングされるので、電子部品実装機において前記マスターバッドマークを検出したときにのみ各回路パターン毎のバッドマークの検出動作を実行する。

【0046】従って、マスターバッドマークを検出しなかったときにはバッドマーク検出動作は省略できるので、1基板毎にバッドマークを認識するために要する無駄時間は大幅に削減され部品実装の生産性を向上させることができる。

【0047】また、本願の第2発明によれば、多面取り

基板上の回路パターンに不良の回路パターンがあるときには、多面取り基板の所定位置に不良判定された回路パターンを識別できるような不良回路パターン識別バッドマークが隣り合う所定位置にマーキングされるので、電子部品実装機では不良回路パターン識別バッドマークを検出したとき、この不良回路パターン識別バッドマークから識別できる回路パターンを除く他の回路パターンに対して部品実装の動作を実行すればよく、不良回路パターン存在マークを検出しなかったときにはバッドマーク認識動作は省略でき、また、各不良回路パターン識別バッドマークは隣り合う位置にマーキングされるので、これを検出するための移動距離は小さくなる。従って、1基板毎にバッドマークを認識するために要する無駄時間は削減され部品実装の生産性を向上させることができる。

【0048】更に、本願の第3発明によれば、回路パタ ーン検査工程において複数の回路パターンから不良が検 出されたときには多面取り基板の所定位置にマスターバ ッドマークがマーキングされると共に、不良回路パター ン識別バッドマークがマスターバッドマークと隣り合う 所定位置にマーキングされるので、電子部品実装機で は、前記マスターバッドマークを検出したときに不良回 路パターン識別バッドマークの検出動作を行って、この 不良回路パターン識別バッドマークから識別できる回路 パターンを除く他の回路パターンに対して部品実装の動 作を実行すればよく、マスターバッドマークが検出され なかったときにはバッドマーク認識動作は省略でき、ま た、各マークは隣り合う位置にマーキングされているの で、これを検出するための移動距離は小さくなる。従っ て、1基板毎にバッドマークを検出するために要する無 駄時間は大幅に削減され部品実装の生産性を向上させる ことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態に係る多面取り基板上の検出マーク位置と検出動作経路を示す平面図。

【図2】第1の実施形態に係る電子部品実装機の動作手順を示すフローチャート。

【図3】本発明の第2の実施形態に係る多面取り基板上の検出マーク位置と検出動作経路を示す平面図。

【図4】本発明の第3の実施形態に係る多面取り基板上の検出マーク位置と検出動作経路を示す平面図。

【図5】電子部品実装機の要部構成を示す斜視図。

【図6】従来例に係る多面取り基板上の検出マーク位置 と検出動作経路を示す平面図。

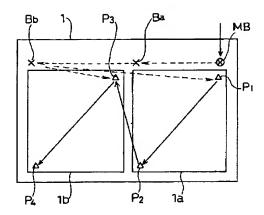
【符号の説明】

1、2、3 多面取り基板

1a、1b、2a、2b、3a、3b 回路パターン B_a 、 B_b バッドマーク

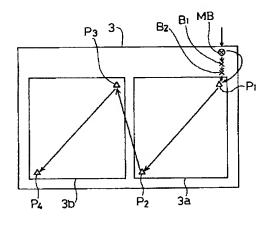
MB マスターバッドマーク

【図1】



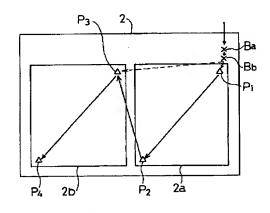
1…多面取り基板 1。、1。…回路パターン MB…マスターバッドマーク B。、B。…バッドマーク

【図4】



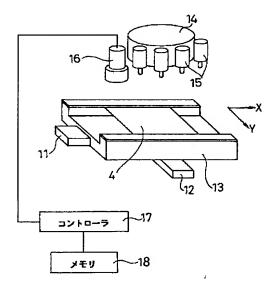
3…多面取り基板 3 a、3 b…回路パターン

【図3】

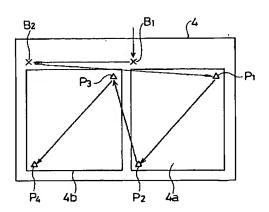


2…多面取り基板 2 a、2 b…回路パターン

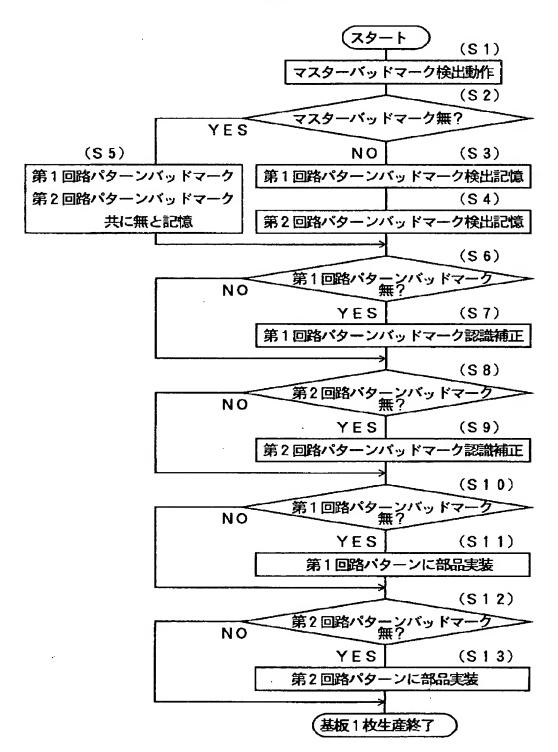
【図5】



【図6】



【図2】



This Page Blank (uspto)